# TERMICZNA ZALEŻNOŚĆ PARAMETRÓW AKUSTYCZNEJ FALI POWIERZCHNIOWEJ W NIOBIANIE LITU O ORIENTACJACH YZ I 128°YX W ZAKRESIE OD 20°C DO 500°C

#### Ernest Brzozowski1)

Przedstawiono obliczenia temperaturowego współczynnika zmian częstotliwości (TWCz) akustycznych fal powierzchniowych (AFP) w niobianie litu (LiNbO<sub>3</sub>) w funkcji kąta cięcia kryształu. Przedstawiono wyniki pomiarów TWCz i tłumienia linii opóźniających z AFP w niobianie litu o orientacjach YZ i 128°YX w zakresie temperatur od 20°C do 500°C. Porównano wyniki obliczeń i pomiarów dla obu orientacji. Stwierdzono, że niobian litu 128°YX w porównaniu do YZ charakteryzują bardziej liniowe zmiany częstotliwości oraz mniejsze wahania tłumienia w funkcji temperatury, co może znaleźć zastosowanie w czujnikach temperatury.

## 1. WSTĘP

Spośród różnych metod pomiaru temperatury, potencjalnie dużą dokładność i rozdzielczość można uzyskać wykorzystując fale akustyczne wzbudzane w kryształach piezoelektrycznych [1]. Termicznie indukowane zmiany prędkości fali oraz rozszerzalność kryształu umożliwiają rejestrację temperatury w postaci zmian częstotliwości.

Z punktu widzenia zastosowań praktycznych, istotne jest, żeby temperaturowy współczynnik częstotliwości (TWCz) był możliwie duży i liniowy w funkcji temperatury. Jego wartość może być dobierana w pewnych granicach, poprzez wybór odpowiedniego materiału podłoża i orientacji fali akustycznej względem osi krystalograficznych. W przypadku akustycznych fal powierzchniowych (AFP)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa, e-mail: Ernest.Brzozowski@itme.edu.pl

Termiczna zależność parametrów akustycznej fali powierzchniowej...

największy TWCz w zakresie od  $-40^{\circ}$ C do  $160^{\circ}$ C, posiada kryształ niobianu litu (LiNbO<sub>3</sub>) o orientacji YZ [2]. Okazało się jednak, że jego duże zmiany występują w wysokich temperaturach [3]. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki teoretycznych i eksperymentalnych badań własności fal AFP w LiNbO<sub>3</sub> o orientacjach YZ oraz 128°YX. Prezentowane obliczenia TWCz dotyczą zakresu od 0°C do 110°C, natomiast pomiary TWCz i tłumienia linii opóźniających z AFP zostały wykonane w zakresie temperatur od 20°C do 500°C.

## 2. OBLICZENIA

Opracowano program komputerowy obliczający TWCz akustycznych fal powierzchniowych w oparciu o przedstawione poniżej wyrażenia. Zależność czasu opóźnienia  $\tau$  fali akustycznej od temperatury *T* podłoża linii opóźniającej, schematycznie pokazanej na Rys. 1 wyraża wzór:

$$\tau(T) = \tau(T_o)[1 + a(T - T_o) + b(T - T_o)^2 + \dots + udT/dt]$$
(1)

gdzie:

 $T_o$  – temperatura odniesienia,

*a*, *b* – współczynniki czułości I-go i II-go rzędu,  $a=d\tau/dT$ ,  $b=d^2\tau/dT^2$ ,

u – stała czasowa szybkości reakcji na skokową zmianę temperatury.



**Rys. 1.** Schemat linii opóźniającej. **Fig. 1.** Schematic illustration of delay line.

Przesunięcie fazowe fali w linii schematycznie przedstawionej na Rys. 1 w temperaturze  $T_{a}$  wynosi:

$$\varphi = \omega \tau$$
 (2)

gdzie pulsacja  $\omega = 2\pi f$ , natomiast czas opóźnienia  $\tau$  jest funkcją prędkości v fali powierzchniowej i długości drogi l, którą fala pokonuje między środkami przetworników:

$$\tau = \frac{l}{v} \tag{3}$$

Po podstawieniu wzoru (3) do wzoru (2) uzyskuje się:

$$\phi = 2\pi f \cdot \frac{l}{v} \tag{4}$$

Temperatura podłoża wpływa na czas opóźnienia  $\tau$  poprzez zmianę prędkości fali *v* oraz drogi l. W celu utrzymania stałego przesunięcia fazowego  $\varphi$ , zgodnie ze wzorem (4), należy zmieniać częstotliwość fali.

Temperaturowy współczynnik zmian częstotliwości jest określony jako:

$$TWCz = \left(\frac{1}{f_0}\frac{\partial f}{\partial T}\right)_{\phi=const}$$
(5)

Z zależności (1, 4, 5) wyprowadzany jest wzór:

$$TWCz = \frac{1}{v_0} \frac{v_T - v_0}{T - T_0} - \lambda_T \tag{6}$$

gdzie:

- $T_{o}$  temperatura odniesienia,
- T temperatura podłoża,
- $v_{o}$  prędkość fali w temperaturze odniesienia,
- $v_T$  prędkość fali w temperaturze *T*,
- $\lambda_T$  współczynnik rozszerzalności podłoża [4].

Do obliczeń  $v_0$  i  $v_T$  wykorzystano algorytm opisany w [5-6]. Prędkości  $v_0$  obliczono wykorzystując stałe materiałowe  $c^{E}_{ijkP} e_{ijk} \varepsilon^{S}_{ik} \rho$  [7]. Aby obliczyć  $v_T$  wyznaczono wartości stałych materiałowych w temperaturach T (0 i 110 °C) przy założeniu liniowej zależności termicznej:

$$c^{E}_{ijkl}(T) = c^{E}_{ijkl}(T_{0}) \cdot \left[1 + Tc^{E}_{ijkl} \cdot (T - T_{0})\right]$$

$$e_{ijk}(T) = e_{ijk}(T_{0}) \cdot \left[1 + Te_{ijk} \cdot (T - T_{0})\right]$$

$$\varepsilon^{S}_{ik}(T) = \varepsilon^{S}_{ik}(T_{0}) \cdot \left[1 + T\varepsilon^{S}_{ik}(T - T_{0})\right]$$

$$\rho(T) = \rho(T_{0}) / \left[1 + (\lambda_{11} + \lambda_{22} + \lambda_{33}) \cdot (T - T_{0})\right],$$
(7)

gdzie:

indeksy *i*, *j*, *k*, *l* przyjmują wartości od 1 do 3  $T_0 = 25^{\circ}$ C,  $c^{E}_{ijkl}$  – stałe sztywności mechanicznej przy zerowym polu elektrycznym [N/m<sup>2</sup>],  $Tc^{E}_{ijkl}$  – temperaturowe współczynniki stałych  $c^{E}_{ijkl'}$   $e_{ijk}$  – stałe sztywności piezoelektrycznej [C/m<sup>2</sup>],  $Te_{ijk}$  – temperaturowe współczynniki stałych  $e_{ijk}$ ,  $\varepsilon^{s}_{_{ik}}$  – stałe przenikalności elektrycznej przy zerowym odkształceniu [F/m],

 $T\hat{\varepsilon}_{ik}^{s}$  – temperaturowe współczynniki stałych  $\varepsilon_{ik}^{s}$ ,

 $\rho$  – gęstość podłoża [kg/m<sup>3</sup>],

 $\lambda_{ii}$  – stałe rozszerzalności liniowej podłoża [8].

Podczas obliczeń kierunek i płaszczyzna propagacji fali były określane za pomocą kątów Eulera:  $\psi$ ,  $\mu$ ,  $\theta$  (Rys. 2), które służą do opisu położenia układu odniesienia związanego falą (X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub>) względem układu odniesienia związanego osiami krystalograficznymi (X, Y, Z). Kąty Eulera wykorzystywane są również do orientacji płytek kryształów z AFP [5, 9].



**Rys. 2.** Definicja kątów Eulera. **Fig. 2.** Euler's angles definition.

Przecięcie płaszczyzn XY i  $X_1X_2$  wyznacza linię węzłów w. Kąt  $\psi$  jest zawarty między osią X a linią węzłów w, kąt  $\mu$  jest zawarty między osią Z a osią - $X_3$ , kąt  $\theta$  jest zawarty między linią węzłów w a osią  $X_1$ . W przypadku gdy  $\mu = 0$  lub  $\mu = \pi$ przyjmujemy , że linia węzłów w pokrywa się z osią  $X_1$ .



**Rys. 3.** Temperaturowy współczynnik częstotliwości (TWCz) w płaszczyźnie cięcia Y w funkcji kąta  $\theta$ .

Fig. 3. Temperature coefficient of frequency (TCF) in Y cut plate versus angle  $\theta$ .

80 wektor 128°YX normalny 78 k<sup>2</sup> 5,43% [TWCz] [ ppm/°C] k<sup>2</sup> 0,034 % 76 64°YX 74 72 ZX YX 70 YX 0 30 60 90 120 150 180

Wykonano dwie serie obliczeń TWCz: w funkcji kąta propagacji ( $\theta$ ) w płaszczyźnie cięcia Y (Rys. 3) oraz w funkcji kąta obrotu ( $\mu$ ) cięcia Y-obrotowego (Rys. 4).

**Rys. 4.** Temperaturowy współcznnik częstotliwości (TWCz) w funkcji kąta obrotu  $\mu$  cięcia Y-obrotowego.

Fig. 4. Temperature coefficient of frequency versus angle  $\mu$  of rotatet Y cut.

μ[°]

W płaszczyźnie Y (Rys. 3), w zależności od kąta propagacji  $\theta$  wartość modułu TWCz waha się w granicach od 75 ppm/°C do 95 ppm/°C. Potencjalnie najlepsza orientacja do zastosowania w pomiarach temperatury, czyli orientacja o najwięk-szym |TWCz|, to YZ (0°,90°, $\theta$  = 90°). W funkcji kąta obrotu  $\mu$  (Rys. 4) |TWCz| waha się w granicach od 71,9 ppm/°C do 79 ppm/°C. Przebieg jest niesymetryczny w badanym zakresie kątów. Z tej serii, do pomiarów temperaturowych należałoby wybrać orientację 64°YX, jednakże współczynnik sprzężenia elektromechanicznego k<sup>2</sup> wynosi tylko 0,034% co zmniejszyłoby czułość. Wybrano więc orientację 128°YX charakteryzującą się dużym k<sup>2</sup> = 5,4% oraz |TWCz| wynoszącym 72 ppm/°C.

Podsumowując, do eksperymentów wybrano dwa podłoża: 128°YX i w celach porównawczych YZ [3].

## **3. POMIARY**

Do badań eksperymentalnych zastosowano linię opóźniającą DL 701 z aluminiowymi elektrodami przetworników [10]. Linię zmontowano w obudowie PCZ-24 (Kazel) przy pomocy metalowych uchwytów w sposób eliminujący naprężenia mechaniczne i ładunki gromadzące się przy zmianach temperatury (Rys. 5). Badane podzespoły rozgrzewano do wymaganej temperatury w piecu N20/HR (Nabertherm) Termiczna zależność parametrów akustycznej fali powierzchniowej...

sterowanym przez mikroprocesor połączony z termoparą i grzałkami elektrycznymi. Do badania charakterystyk linii opóźniających użyto analizatora sieci HP 8752A.



**Rys. 5.** Ilustracja linii opóźniającej w obudowie. **Fig. 5**. Schematic illustration of delay line in package.

Przykładową charakterystykę amplitudową i fazową linii na LiNbO<sub>3</sub> o orientacji 128°YX przedstawiono na Rys. 6. Przy wzroście temperatury kryształu następuje przesunięcie charakterystyk, bez zmiany kształtu, w kierunku mniejszych częstotliwości. Wartość przesunięcia charakterystyki fazowej jest określona przez wzór (5).





Fig. 6. Amplitude (a) and phase (b) characteristic of delay line DL 701 on 128°YX LiNbO<sub>3</sub>.

Aby zbadać właściwości linii pod kątem pracy w układzie generacyjnym, częstotliwość *f* i tłumienie *A* mierzono w punkcie  $\varphi = 0^{\circ}$  położonym w okolicy maksimum transmisji (Rys. 6).

Wartości  $f_0$  i  $A_0$  w temperaturze 20°C wyniosły odpowiednio 70,2MHz i 16,1dB dla orientacji 128°YX, oraz 61,9MHz i 17,1dB dla orientacji YZ. Dokładności określenia częstotliwości i temperatury wynosiły odpowiednio ±100Hz i ±1°C. Skalowanie układu pomiarowego wykonano umieszczając zamiast linii opóźniającej element o tłumieniu zerowym. Pomiary przeprowadzono w zakresie do 500°C. Ograniczenie maksymalnej temperatury pracy LiNbO<sub>3</sub> wynika z dekompozycji tego kryształu, która powoli zaczyna się w 300°C, a przyspiesza powyżej 500°C [11].



**Rys. 7.** Zmiany częstotliwości  $f|_{\varphi=0^{o}}$  w funkcji temperatury linii opóźniającej. **Fig. 7.** Changes of frequency  $f|_{\varphi=0^{o}}$  versus delay line temperature.

Na Rys. 7 przedstawiono zmiany częstotliwości w funkcji temperatury. W przypadku orientacji YZ częstotliwość malała wyraźnie nieliniowo, co pokrywa się z danymi zamieszczonymi w [3]. W przypadku orientacji 128°YX zmiany częstotliwości przebiegają bardziej liniowo. W celu określenia czy |TWCz| zmienia się w funkcji temperatury wykreślono zależność:  $|TWCz|_k = (1/f_{k-l}) \cdot (f_k - f_{k-l})/(T_k - T_{k-l})$ , gdzie k = 1, 2..5, a  $T_{k=0} = 20$ °C (Rys. 8).

Moduł TWCz dla obydwu orientacji nie jest stały w funkcji temperatury. Dla orientacji YZ maleje w granicach od 97 ppm/°C do 41 ppm/°C, natomiast dla orientacji 128°YX czterokrotnie wolniej wzrasta: od 75 ppm/°C do 89 ppm/°C.

W badanym zakresie temperatur tłumienności wtrącenia linii dla orientacji 128°YX i YZ, przedstawione na Rys. 9, zmieniają się odpowiednio o 2dB i 7dB. Zmiany tłumienia dla orientacji dla orientacji 128°YX są na tyle małe, że nie stanowią przeszkody w wykorzystaniu tego podzespołu w układzie generacyjnym.



Termiczna zależność parametrów akustycznej fali powierzchniowej...

**Rys. 8.** Temperaturowy współczynnik częstotliwości |TWCz| w funkcji temperatury. **Fig. 8.** Temperature coefficient of frequency dependence of |TCF| changes.



**Rys. 9.** Zmiany tłumienności wtrącenia w funkcji temperatury. **Fig. 9.** Temperature dependence of insertion loss changes.

## 4. WNIOSKI

Z przeprowadzonych badań AFP wynika, że z punktu widzenia zastosowań w czujnikach temperatury, niobian litu o orientacji 128°YX jest lepszy w porównaniu do orientacji YZ zarówno pod względem liniowości zmian częstotliwości jak i ze względu na małe zmiany tłumienia w zakresie temperatur od 20°C do 500°C.

Rozbieżności między obliczonymi a zmierzonymi wartościami TWCz są rzędu 3 ppm/°C (4%) i wynikają z błędów pomiarowych.

## LITERATURA

- [1] Hoummady H., Hauden D.: Acoustic wave thermal sensitivity: temperature sensors and temperature compensation in microsensors, *Sensors and Actuators A*, 44 (1994) 177
- [2] Neumeister J., Thum R., Lüder E.:A SAW delay-line oscillator as a high-resolution temperature sensor, *Sensors and Actuators A21-A23* (1990) 670
- [3] Hornsteiner J., Born E., Fischerauer G., Richa E.: Surface acoustic wave sensors for high-temperature applications, *IEEE International Frequency Control Symposium* (1998) 615
- [4] Nye J.F.: Własności fizyczne kryształów, PWN 1962, 38
- [5] Campbell J., Jones W.: A method for estimating optimal crystal cuts and propagation directions for excitation of piezoelectric surface waves, *Trans. on Sonics and Ultrason.*, 15, 4 (1968) 209
- [6] Soluch W., Łysakowska M.: Obliczenia i pomiary parametrów akustycznych fal powierzchniowych w niobianie litu o orientacji 128°YX. *Elektronika*, 41, 3 (2000) 18
- [7]. Smith R.T., Welsh F.S.: Temperature dependence of the elastic, piezoelectric, and dielectric constants of lithium tantalate and lithium niobate, *J.Appl.Phys.*, 42, 6 (1971) 2219
- [8] Kim Y., Smith R.: Thermal expansion of lithium niobate single crystals, J. Appl. Phys., 40, 11 (1969) 4637
- [9] Poradnik inżyniera, WNT, Warszawa 1971, 375
- [10] Soluch W.: Design of SAW delay lines for sensors, Sensors and Actuators A, 67 (1998) 60
- [11] Hauser R., Reindl L., Biniasch J.: High-temperature stability of LiNbO<sub>3</sub> based SAW devices, *IEEE Ultrasonics Symposium*, (2003) 192

## **SUMMARY**

# TEMPERATURE DEPENDENCE OF SURFACE ACOUSTIC WAVE PARAMETERS IN YZ AND 128°YX ORIENTED LITHIUM NIOBATE IN TEMPERATURE RANGE FROM 20°C TO 500°C.

Results of calculations of temperature coefficient of frequency (TCF) of surface acoustic wave (SAW) in lithium niobate as a function of crystal cut angle are presented. Results of measurements of TCF and attenuation in SAW delay line on YZ and 128°YX lithium niobate substrate are presented as a function of temperature change in the range from 20°C to 500°C. The comparison of orientations YZ and 128°YX shows that the second one is characterised by better frequency change linearity and lower attenuation variation with temperature. The 128°YX lithium niobate substrate is potentially applicable in temperature sensors.